

## 走査型電子顕微鏡 (SEM)



メーカー	日本電子株式会社
型式	JSM-7600F
概要	<p>走査型電子顕微鏡(SEM:Scanning Electron Microscope)は電子線を試料に当てて表面を観察する装置で、様々な分野で幅広く利用されています。</p> <p>本装置はセミアインレンズ方式により、高倍率、高分解能観察が可能で、各種オプションにより、元素分析 (EDS) やカソードルミネッセンス (CL) 測定も可能です。</p>
仕様	<p>対物レンズ：セミアインレンズ方式  倍率：×25～×1,000,000  二次電子像分解能：1.5nm (1kV時) /GBmode  1.0nm (15kV時)  加速電圧：0.1kV～30kV  試料照射電流：1pA～2nA  検出器：上方検出器、下方検出器、反射電子検出器</p>
オプション	<p>EDS(Oxford)、CL(Gatan)  非導電性試料へ導電性を付与するためのコーティングは、オペレーターが作業を行います (追加利用料なし)。</p>
利用条件	<p>試料サイズ：最大φ32mm×高さ20mmまで  (それ以上のサイズはご相談ください)  試料の状態：導電性試料  (コーティング可能であれば非導電性でも可)  含水試料は不可</p>
設置場所	地域産学連携研究センター 装置室A
利用料	5,500円/時間 (税込)
連絡先	<p>予約、利用相談は電話又はメールにてお問い合わせください。  044-934-7250 (内線7250)  cii●mics.meiji.ac.jp  (●の部分を実に@に置き換えてお送りください)</p>